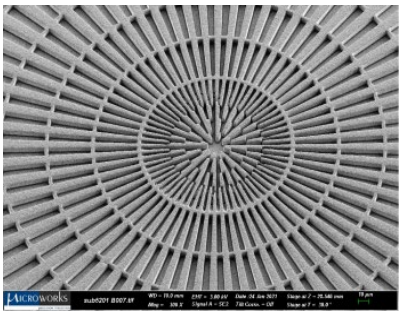
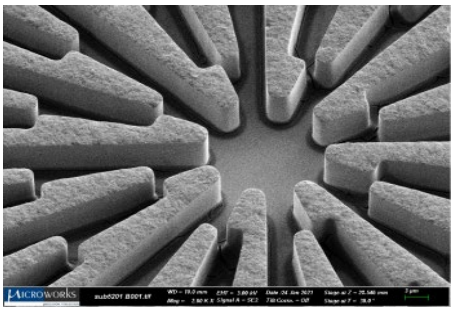
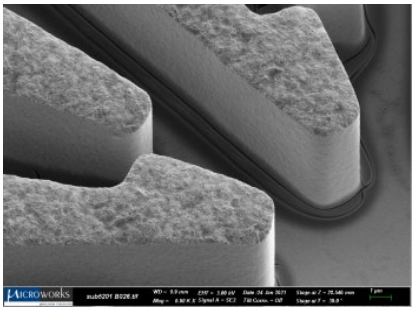
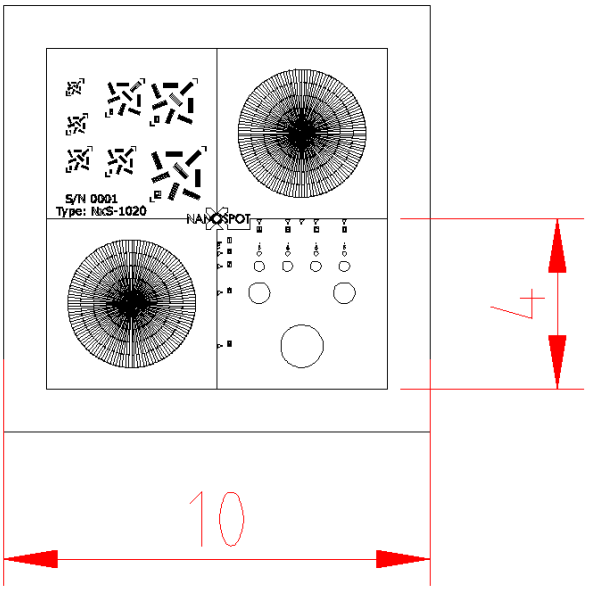
NanoXSpot分辨率测试卡

外形尺寸	10 mm x 10 mm基片 尺寸: 40 mm x 30 mm x 5 mm 支架含蓝宝石窗口
材料	基底: 200 μm硅 吸收体: 8 μm高金
线/空间宽度公差	Tolerance: +/- 15%
图案线宽	4象限区域，每个区域4 mm x 4 mm，含两个改良的西门子星，孔阵列（最小孔径5微米），7组有不同方向的线对（12 μm, 10 μm, 8 μm, 6 μm, 5 μm, 4 μm, and 3 μm）

布局图



定制化分辨率测试卡:

提供客户要求（设计，吸收体高度，尺寸等）进行定制。

请联系我们
北京众星联恒科技有限公司
北京市海淀区信息路1号_1-2号楼B栋　电话：+86-10-86467571　　邮箱:sales@top-unistar.com